## イオントラック内反応による高温・高強度放射線環境下で用いる 自己強化型・ナノ材料の開発

Self-reinforced Nano Materials with Ultra-high Heat and Radiation Resistance Produced by Single Particle Nanofabrication Technique

関 修平、佃 諭志、田川精一<sup>1)</sup> 杉本雅樹<sup>2)</sup>

Shu SEKI, Satoshi TSUKUDA, Seiichi TAGAWA Masaki SUGIMOTO

<sup>1)</sup>大阪大学 <sup>2)</sup>原子力機構

高分子材料に対する「単一粒子ナノ加工法」の適用により、架橋高分子ナノ組織体を形成すると同時 に、その高温環境下における無機転換反応、あるいは高分子自己凝集特性を生かした雰囲気応答型ナ ノ粒子の形成に成功した。

キーワード:ナノワイヤー、ナノ粒子、単一粒子ナノ加工、高分子架橋、セラミック

<u>1.目的</u>

本研究では、提案者らが開発した1個1個の高エネルギーイオンが材料中で起こす1次元超微細空間中での 反応を利用した、全く新しいナノ構造材料形成法をベースとして、太さ・長さがサブナノメートルレベルで 完全にコントロールされたポリカルボシランの1次元構造体を形成し、高温下で焼成し無機転換にすること により高強度耐熱性有機材料の開発を行うことを目的とする。同時に原子炉などの特殊環境化の被覆材とし て用いること提案し、使用するごとに「自己強度化」する新しいタイプの材料の開発を狙う。一方、高度に 制御されたマイクロビーム技術を駆使して、形成されるナノ構造体の高い位置制御性を確保する。

<u>2 . 方法</u>

ターゲットとなる高分子材料の薄膜を作成し、これに対し原子力機構・高崎量子応用研究所・TIARA 加速器群からの高エネルギーイオンビーム・マイクロビームの照射を行った。基板上に形成されたナ ノワイヤーの原子間力顕微鏡・走査型電子顕微鏡による直接観察の後、 高温場におけるセラミック 転換反応、 溶媒雰囲気のコントロールによる自己凝集性コントロール、を行い、形成されたナノワ イヤー及びその集合体の形態変化観察・組成分析・特性解析を行った。

## 3.研究成果

3-1. セラミックナノワイヤー

ポリシラン・ポリカルボシラン等の無機骨格を有する高分子は高い効率で SiC への転換反応を引き起 こす事が知られている。本項では、PCS ナノワイヤーを雰囲気制御熱転換反応によって、Si-C 或いは Si-O 構造を有する構造体へ転換反応を行った。Si 基板上の PCS 薄膜に対し、真空中で各種イオンビ ームの均一照射を行って PCS ナノワイヤーを形成した。照射後、benzene による現像に続いて、高温 炉を用いて焼成することにより無機転換反応を行った。

焼成前後に観測されたナノワイヤーの AFM 像を Fig.3-1 に示す。ナノワイヤーは 1000 ℃ を超える温 度条件において安定に焼成され、セラミクスナノワイヤーへ転化すると同時に、極めて高い耐熱性を 有する。また、焼成反応にともない、顕著な動径方向の収縮が観測され、この体積変化から算出され た元素組成比の変化は、通常の PCS-β-SiC 転化反応における変化と良い一致を示した。動径方向の顕 著な収縮に対して、ナノワイヤーの長軸方向の収縮はほとんど認められず、基板との強い相互作用に よって動径方向の収縮が優先されたためであると考えられる。これは架橋 PCS ナノワイヤーの長さ が、最終的な SiC ナノワイヤー長によく反映できることを示唆しており、さまざまに長さをコントロ ールした架橋 PCS ナノワイヤーをベースに焼成された SiC ナノワイヤーの形成結果を Fig. 3-2 に示す。 このように、単一粒子ナノ加工法におけるナノワイヤーの長さ・太さのセラミックナノワイヤーを必 要な数だけ創ることが可能となった。 3-2. 高分子多層膜を用いた多段式ナノワイヤーの形成

単一粒子ナノ加工法で用いる粒子のうち、最もエネルギーの高い粒子では、その飛程が数 100 μm~に 及ぶため、異種の高分子から構成される高分子多層膜をターゲットとして用いた場合、それぞれの層 を構成する高分子をベースとしたナノワイヤーの"連結体"を形成できる可能性がある。本項では溶媒 に対する親媒性の大きく異なる高分子を多層化し、その界面を明確に維持した上で、単一粒子ナノ加 工法の適用によって「多段型」ナノワイヤーの形成を試みた結果について紹介する。高分子多層膜 は極性・非極性溶媒に溶解する高分子を交互に積層するため、PMPS、polyhydroxystyrene (PHS)、PCS の3種を用いて2層又は3層膜とした。この多層膜に対し、十分な飛程が確保され、かつ透過におけ るLET 変化が無視できる 320 MeV Ru 及び 454 MeV Xe イオンビーム照射によりナノワイヤー形成を 試みた。

PMPS(第1層) - PHS(第2層)により構成される2層膜のPMPS層のみを、benzeneを用いて現像した後、観測されたナノワイヤーのAFM像をFig. 3-3 (a)に示す。Benzeneにはほとんど溶解しないPHS層上に、孤立したPMPSナノワイヤーが確かに観察され、その長さはPMPS層の厚みをよく反映している。続いてPHS層の現像を行った結果がFig. 3-3 (b)である。PMPS - PHS両層の厚みの総和を反映したナノワイヤーの長さが観測され、2段構造ナノワイヤーの形成が確認された。

次に3層膜を用いての3段構造を持つナノワイヤー形成を試みた。PMPS(第1層) - PHS(第2層) - PCS(第3層)の順で成膜した3層膜にイオンビームを照射し、照射後トルエンとイソプロピルアルコール(IPA)の2:1の混合溶液中で3層膜すべてを一括で現像を行った後、観測されたAFM像をFig. 3-4 に示した。低フルーエンス照射の場合(1.1 x 109 ions/cm2) それぞれのナノワイヤーは基板上で完全に単離されている(Fig. 3-4(a))。現像段階において、溶媒中でPMPS, PCSで形成されたワイヤーセグメントは伸びた状態になると予測されるのに対し、PHS部は選択的に自己凝集をおこすため、凝集したPHS部分から2本のワイヤーが"生えて"いる構造体が観察された。ナノワイヤーの数密度を増加させると、PHS部の凝集は、ワイヤー1本中での凝集からワイヤー数本の凝集へと広がり、Fig.3-4(b)に見られるようなPHS凝集部分から放射状にPHS, PMPSナノワイヤーが"生えた"構造体へと形態を変化させた。このとき"3段"構造を反映して、中央の凝集部分から"生えた"ナノワイヤーの数は必ず偶数として観測されることを付記しておく。さらにフルーエンスを上げていくと、溶媒中でのPHS部の選択凝集に参加するナノワイヤーの物理的本数が増加するため、Fig.3-4(c)に見られるようにスターバースト型ナノ粒子が形成される。



Figure 3-1. AFM micrographs of PCS (a) and SiC nanowires. The PCS nanowires were formed using a 450 MeV Xe beam by irradiating PCS thin films. SiC nanowries were prepared by heating the SiC nanowires at 1000 °C.



Figure 3-2. AFM micrographs of SiC nano-wires with different length. The PCS nanowires were formed using a 500 MeV Au beam by irradiating PMPS thin films (thickness (a) 190 (b) 580 and (c) 1200 nm) at  $1.0 \times 10^9$ 

ions/cm<sup>2</sup>.



Figure 3-3. AFM micrographs of two-segment PHS/PMPS nanowires prepared by exposing a PHS/PMPS two-layer film to a 322 MeV  $^{102}$ Ru<sup>18+</sup> ion beam at an ion fluence of  $1.0 \times 10^9$  ions/cm<sup>2</sup>. Images show nanowires after development with (a) benzene followed by (b) IPA. Micrographs c-d are observed for the nanowires after one-step development using toluene/IPA solvents at ratios of (c)1:2, (d) 1:1, and (e) 2:1



Figure 3-4. AFM micrographs of three-segment PMPS/PHS/PCS nanowires prepared by exposing the corresponding three-layer films to a 454 MeV  $^{129}$ Xe<sup>25+</sup> ion beam at ion fluences of (a)  $1.1 \times 10^{9}$ , (b)  $5.3 \times 10^{9}$  and (c)  $1.0 \times 10^{10}$  ions/cm<sup>2</sup> followed by development in toluene/IPA solution (2:1)

## <u>4.結論・考察</u> 前項にまとめて記載

## 5.引用(参照)文献等

- 1) Tsukuda, S.; Seki, S.; Sugimoto, M.; Tagawa, S. J. Phys. Chem. 2006, B110, 19319.
- 2) Seki, S.; Tsukuda, S.; Tagawa, S.; Sugimoto, M. Macromolecules, 2006, 39, 7446.
- 3) 杉本雅樹, 吉川 正人, 関 修平, 佃 諭志, 田川 精一, "イオンビーム照射によるセラミックナノワイヤーの 製造法", 特願2005-269602.